

JIS

電気絶縁用セラミック材料 試験方法

JIS C 2141-1992

(1997 確認)

(2002 確認)

(2008 確認)

平成 4 年 8 月 1 日 改正

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

主 務 大 臣：通商産業大臣 制定：昭和 49.6.1 改正：平成 4.8.1

官 報 公 示：平成

原案作成協力者：日本電子材料工業会

審 議 部 会：日本工業標準調査会 電気部会（部会長 増田 閃一）

この規格についての意見又は質問は、工業技術院標準部電気規格課（〒100 東京都千代田区霞が関 1 丁目 3-1）へ連絡してください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第 15 条の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

**電気絶縁用セラミック材料
試験方法**

C 2141-1992

Testing methods of ceramic insulators for electrical
and electronic applications

1. **適用範囲** この規格は、電気機器及び電子機器に使用するセラミック絶縁材料（以下、セラミックスという。）の試験方法について規定する。

備考1. この規格の引用規格を、次に示す。

JIS B 0601 表面粗さの定義と表示

JIS B 0651 触針式表面粗さ測定器

JIS B 7410 石油類試験用ガラス製温度計

JIS B 7502 外側マイクロメータ

JIS B 7503 0.01 mm目盛ダイヤルゲージ

JIS B 7507 ノギス

JIS B 7734 微小硬さ試験機

JIS C 1303 高絶縁抵抗計

JIS C 2320 電気絶縁油

JIS R 1611 ファインセラミックスのレーザフラッシュ法による熱拡散率・比熱容量・熱伝導率
試験方法

JIS R 3503 化学分析用ガラス器具

JIS Z 8401 数値の丸め方

JIS Z 8704 温度の電氣的測定方法

2. この規格の対応国際規格を、次に示す。

IEC 672-2 (1980) Specification for ceramic and glass insulating materials. Part 2: Methods of test

2. **用語の定義** この規格で用いる主な用語の定義は、次による。

- (1) **かさ体積** セラミックスの固体部分のほかに閉ざされた気孔と開かれた気孔とを含めた全体積。
- (2) **見掛体積** セラミックスのかさ体積から開かれた気孔を除いた体積。
- (3) **見掛気孔率** セラミックスの閉ざされた気孔を除き、開かれた気孔だけの全体積のかさ体積に対する百分比。
- (4) **かさ密度** セラミックスの質量を、そのかさ体積で除した商。
- (5) **見掛密度** セラミックスの質量を、その見掛体積で除した商。